(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



1 10010 BURESEN IN BURESE (BUR BORN BORN BORN BUR 11 10 KINDE 1101) BURES (BUR BUR BUR BUR BUR BUR BUR 1101 HO

(43) 国際公開日 2005 年12 月29 日 (29.12.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/124857 A1

(51) 国際特許分類?:

H01L 23/12, 25/065, 25/07, 25/18

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2005/010549

(22) 国際出願日:

2005年6月9日(09.06.2005)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2004-178756 2004年6月16日(16.06.2004) JF

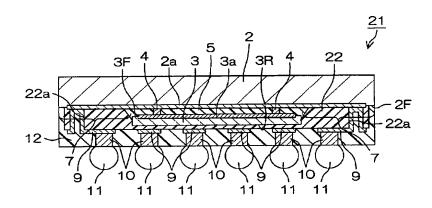
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): ローム 株式会社 (ROHM CO., LTD.) [JP/JP]; 〒6158585 京都 府京都市右京区西院溝崎町 2 1 番地 Kyoto (JP). (72) 発明者; および

- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 谷田 一真 (TANIDA, Kazumasa) [JP/JP]; 〒9830803 宮城県仙 台市宮城野区小田原 2 丁目 6 番 4 8 号コーポ MT K 1 0 2 Miyagi (JP). 森藤 忠洋 (MORIFUJI, Tadahiro) [JP/JP]; 〒6158585 京都府京都市右京区西 院溝崎町 2 1番地 ローム株式会社内 Kyoto (JP). 宮 田修 (MIYATA, Osamu) [JP/JP]; 〒6158585 京都府京 都市右京区西院溝崎町 2 1番地 ローム株式会社内 Kyoto (JP).
- (74) 代理人: 稲岡 耕作. 外(INAOKA, Kosaku et al.); 〒5410054 大阪府大阪市中央区南本町2丁目6番12号 サンマリオンNBFタワー21階 あい特許事務所内 Osaka (JP).

/続葉有/

(54) Title: SEMICONDUCTOR DEVICE

(54) 発明の名称: 半導体装置



(57) Abstract: A semiconductor device includes a first semiconductor chip, which has a first functional plane whereupon a first functional element is formed and a first rear plane which is a plane opposite to the first functional plane; a second semiconductor chip, which has a second functional plane whereupon a second functional element is formed and a facing region facing the first functional plane of the first semiconductor chip and a non-facing region which is a region other than the facing region are provided; a connecting material for electrically connecting the first functional element and the second functional element in a facing part of the first functional plane and the second functional plane; an insulating film continuously formed to cover the non-facing region of the second semiconductor chip and the first rear plane of the first semiconductor chip; rewiring formed on a front plane of the insulating film to be electrically connected with the second functional element; a protecting resin covering the rewiring; and an external connecting terminal arranged to stand by penetrating the protecting resin from the rewiring.

(57)要約: 第1機能素子が形成された第1機能面、およびこの第1機能面とは反対側の面である第1裏面を有する第1半導体チップと、第2機能素子が形成され、上記第1半導体チップの第1機能面に対向する対向領域、およびこの対向領域以外の領域である

2005/124857 A1

00

- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護 が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ,

BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), $\exists -\Box \lor \land (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).$

添付公開書類:

--- 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。